

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **2 711 662**

21 Número de solicitud: 201990025

51 Int. Cl.:

H01Q 3/20 (2006.01)

H01Q 19/19 (2006.01)

12

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA

R1

22 Fecha de presentación:

31.08.2017

30 Prioridad:

19.09.2016 CN 201610828474

43 Fecha de publicación de la solicitud:

06.05.2019

88 Fecha de publicación diferida del informe sobre el estado de la técnica:

31.01.2020

71 Solicitantes:

**SINOTRUST MARINE (ZS) SATELLITE
COMMUNICATION CO., LTD. (50.0%)
Floor 5, Building A2, No.777 Haijing Road, Marine
Science City Lincheng Street, Dinghai District
Zhoushan,
316000 Zhejiang CN y
QI, Changsong (50.0%)**

72 Inventor/es:

**QI, Changsong;
PAN, Hongjun;
ZHUO, Weiguo y
YU, Haihua**

74 Agente/Representante:

**INGENIAS CREACIONES, SIGNOS E
INVENCIONES, SLP**

54 Título: **SISTEMA Y MÉTODO PARA EL RASTREO DE TRAMA FALTANTE DURANTE GIRO DE ANTENA POR SATÉLITE DE REFLECTOR DUAL**

ES 2 711 662 R1

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **2 711 662**

21 Número de solicitud: 201990025

57 Resúmen:

Sistema y método para el rastreo de trama faltante durante giro de antena por satélite de reflector dual. La presente invención divulga un sistema y método para rastrear tramas faltantes durante el giro de una antena por satélite de reflector dual, que se usa para eliminar los defectos del sistema de rastreo automático de antena por satélite existente, comprendiendo un reflector primario, un reflector secundario y una fuente de alimentación, en el que el reflector primario está provisto de una servo unidad de rastreo y una unidad de control principal; el reflector primario y el reflector secundario se disponen coaxialmente con la fuente de alimentación, uno del reflector primario y el reflector secundario pueden girar alrededor del eje y está provisto de un mecanismo de giro, y un área en la que las señales fallan parcialmente se dispone excéntricamente en el reflector primario giratorio o reflector secundario. En comparación con rastreo por pasos, el método tiene las ventajas de precisión alta y respuesta rápida; en comparación con rastreo por exploración cónica, el reflector primario y el reflector secundario se disponen coaxialmente, por lo tanto se reducen los lóbulos laterales, se alivia la interferencia de satélite y se mejora la aplicabilidad; en comparación con rastreo por monoimpulsos, pueden obtenerse señales sinusoidales con fluctuación periódica de intensidad utilizando un área giratoria y excéntrica en la que las señales fallan parcialmente, simple en estructura y baja en costes.

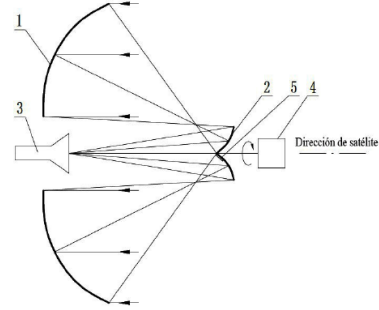


FIG. 1



OFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

②① N.º solicitud: 201990025

②② Fecha de presentación de la solicitud: 31.08.2017

③② Fecha de prioridad: **19-09-2016**

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TECNICA

⑤① Int. Cl.: **H01Q3/20** (2006.01)
H01Q19/19 (2006.01)

DOCUMENTOS RELEVANTES

Categoría	⑤⑥ Documentos citados	Reivindicaciones afectadas
A	CN 103715508 A (HARXON CORP) 09/04/2014, Resumen de la base de datos EPODOC. Recuperado de EPOQUE resumen; figuras.	1-7
A	US 6087985 A (RUEMMELI BERND et al.) 11/07/2000, Columna 1, línea 51 a columna 6, línea 49; figuras 1-8.	1-7
A	US 2011156956 A1 (GRIBBEN DOUGLAS ALAN) 30/06/2011, Párrafos [0009] - [0035]; figuras 1-4.	1-7

Categoría de los documentos citados

X: de particular relevancia

Y: de particular relevancia combinado con otro/s de la misma categoría

A: refleja el estado de la técnica

O: referido a divulgación no escrita

P: publicado entre la fecha de prioridad y la de presentación de la solicitud

E: documento anterior, pero publicado después de la fecha de presentación de la solicitud

El presente informe ha sido realizado

para todas las reivindicaciones

para las reivindicaciones nº:

Fecha de realización del informe
17.01.2020

Examinador
J. Botella Maldonado

Página
1/2

Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación)

H01Q

Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de búsqueda utilizados)

INVENES, EPODOC, WPI, NPL, XPESP, XPAIP, XPI3E, INSPEC.